

蛍光X線分析装置

機種

ZSX primus IV (株式会社リガク)



概要

概要	<p>蛍光X線分析は、試料にX線を照射した時に発生する、元素ごとに固有の蛍光X線の波長（エネルギー）から、試料中の構成元素の種類を分析するものです。また、蛍光X線の強度から、試料を構成する元素の量も測定できます。</p>
主な仕様	<ul style="list-style-type: none">・測定元素 5ホウ素～92ウラン・分光方式 波長分散・照射方式 上面照射型（粉末試料に対応）・マッピング機能 0.5mm以上・膜厚測定 0.1nm～10μm・試料交換 24個ホルダー

この試験装置は、2021年度に公益財団法人JKAの補助金を活用して整備したものです。

